苏试宜特
CHINAISTI TESTING SERVICE

检验检测报告
Testing Report

报告编号：SH2209270043A

试验名称：充电器件模型静电放电试验

试验样品：CI1306

试验部门：失效分析工程处

苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司

Chinaisti (Shanghai) Testing Technology Co., Ltd.

地址：上海市浦东新区金丰路 455 号 2 号厂区

充电器件模型静电放电试验报告

CDM TEST REPORT

委托公司 Company ：成都启英泰伦科技有限公司

公司地址 Address ：成都市高新区天府五街 200 号菁蓉汇 4A 栋 12 楼

产品名称 Sample name ：CI1306
CI1306

委托日期 Date Received ：2022 年 9 月 28 日
Sept 28,2022

完成日期 Date Tested ：2022 年 9 月 29 日
Sept 29,2022

实验室认证体系（Independent Testing Laboratory Certification System）：

本实验室为国家认可的检测实验室，检测管理及技术均符合 CNAS-CL01：2018 《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-A003：2019《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》

认可单位:中国合格评定国家认可委员会(CNAS)　　认可证书号:L15758

CHINAiSTI (SHANGHAI) TESTING TECHNOLOGY CO,LTD is a CNAS-CL01：2018,CNAS-CL01-A003：2019 approved testing laboratory, certified by China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS).
Certification Number: L15758

实验室证明事项（We Hereby Certify That）：

对于本报告所载之测试项目及结果，实验室保证由训练合格之专业技术人员负责执行，并忠实及完整将各项试验结果记录于报告内。

The test(s) shown in the attachment were conducted according to the indicating procedures. We assume full responsibility for the accuracy and completeness of these tests and vouch for the qualifications of all personnel performing them.

	名称（Name）	签名（Signature）	日期（Date）
检测员 Inspector	潘祥仁 Peter Pan	潘祥仁	2022 年 10 月 11 日
报告审核人 Report reviewer	陈清珑 Larry Chen	陈清珑	2022 年 10 月 11 日
报告批准人 Approver	李鹏云 Smile Li	李鹏云	2022 年 10 月 11 日

备 注（NOTE）：

1. 本报告内容以任何方式翻印或复印部份者无效。
   This report will be invalid if reproduced in part or altered in any way.
2. 本报告仅对检送样品负责，且分离使用无效。
   This report refers only to the specimen(s) submitted to test, and is invalid if used otherwise.

报告专用章 CHINAiSTI

3. 本报告需加盖本公司印鉴及签名始生效。
   This report is ONLY valid with the examination seal and signature of this institute.
4. 样品保存自报告签发日起 30 天。
   The tested specimen(s) will only be preserved for thirty days from the date issued, if not collected by the applicant

报 告 内 容

TABLE OF CONTENTS

1 讯息（INFORMATION） 2
1.1 案件讯息（CASE INFORMATION） 2
1.2 试验设备说明（DESCRIPTION OF TEST EQUIPMENT） 2
1.3 环境条件（AMBIENCE CONDITION） 2
1.4 参考文件（REFERENCE DOCUMENT） 2
1.5 测试要求（TEST REQUIREMENT） 2
2 试验结果（TEST RESULTS） 4
2.1 结果汇整（SUMMARY） 4
2.2 测试数据（TEST DATA） 5

1 讯息（INFORMATION）

1.1 案件讯息（CASE INFORMATION）

试验样品 Test Sample	批次号 LOT NO.	封装 Package	数量 Quantity
CI1306	NA	QFN40	12 pcs

1.2 试验设备说明（DESCRIPTION OF TEST EQUIPMENT）

项目 Items	设备/编号 Equipment/No.	型号 Model	校准有效期 Calibration validity
1	1606269	ORION 3	2023年6月24日

1.3 环境条件（AMBIENCE CONDITION）

标准要求温度 Required temperature	25^{+3}_{-5} ℃	实际温度 Actual temperature	22.3~22.9℃
标准要求相对湿度 Required relative humidity	55± 10 %RH	实际湿度 Actual humidity	51.0~56.2%RH

1.4 参考文件（REFERENCE DOCUMENT）

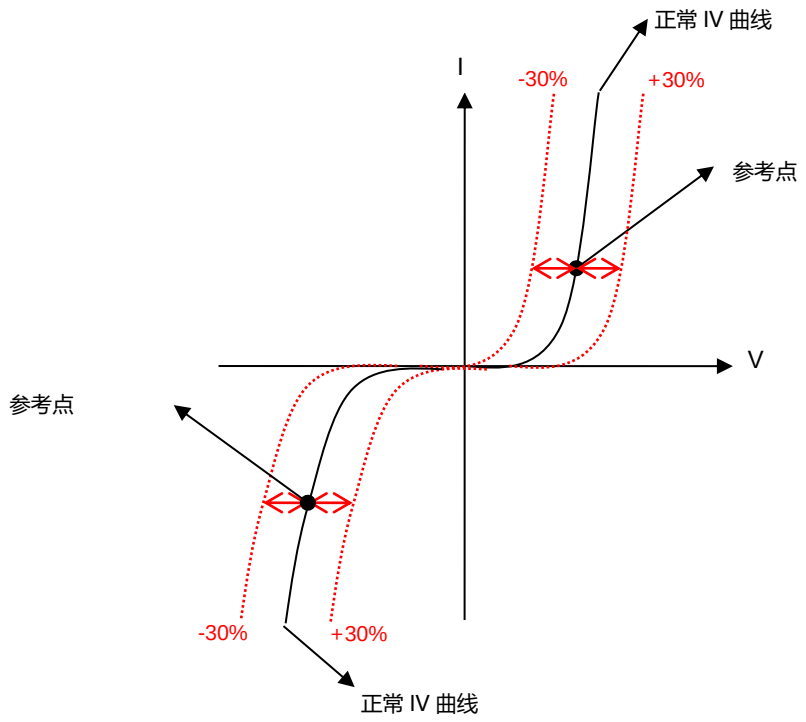
项目 Items	依据标准 Standards
1	JS-002：2018

1.5 测试要求（TEST REQUIREMENT）

500V(±)×3pcs
1000V(±)×3pcs
1500V(±)×3pcs
2000V(±)×3pcs

TEST VOLTAGE	: 500V~2000V,STEP:500V(±);
SAMPLE QUANTITY	: 12 pcs
FUNCTION TEST	: by customer
FAILURE CRITERIA (Reference Only)	: ±30% voltage shift at reference point before/after zapping

※Failure Judgment: Voltage shift over ±30% at reference point.



2 试验结果（TEST RESULTS）

2.1 结果汇整（SUMMARY）

Test Model : CDM	ESD Sensitivity Passed : ±2000V			JS-002：2018 Classification Class : C3
Test condition	**Sample No.**	**Curve Trace Pass Volts**	**FT Testing Pass Volts**	Class C0a <125 V Class C0b 125 to <250 V Class C1 250 to <500 V Class C2a 500 to <750 V Class C2b 750 to <1000 V Class C3 ≧1000 V
500V(±)×3pcs	#1~#3	±500	Unknown	
1000V(±)×3pcs	#4~#6	±1000	Unknown	
1500V(±)×3pcs	#7~#9	±1500	Unknown	
2000V(±)×3pcs	#10~#12	±2000	Unknown	

Discharge Pins All Pins;

2.2 测试数据（TEST DATA）

CDM(500V);			
Tested Pin	**Sample No. & Failed Volt (V)**		
	#1	#2	#3
ALL PINS	IV PASS	IV PASS	IV PASS

CDM(1000V);			
Tested Pin	**Sample No. & Failed Volt (V)**		
	#4	#5	#6
ALL PINS	IV PASS	IV PASS	IV PASS

CDM(1500V);			
Tested Pin	**Sample No. & Failed Volt (V)**		
	#7	#8	#9
ALL PINS	IV PASS	IV PASS	IV PASS

CDM(2000V);			
Tested Pin	**Sample No. & Failed Volt (V)**		
	#10	#11	#12
ALL PINS	IV PASS	IV PASS	IV PASS

《以下空白》

<< The Following Blank >>